



平成28年12月12日

各 位

会 社 名 株式会社日本マイクロニクス
代表者名 代表取締役社長 長谷川正義
(コード番号 6871)
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 齋藤 太
(TEL 0422-21-2665)

新開発GND Block Pin (グラウンドブロックピン) 販売開始のお知らせ

当社はこの度、当社テストソケット「J-Contacts」に組み込んで使用する、デバイスのGNDパット用コンタクタ「GND Block」の接触性を改善した「GND Block Pin」を開発し、販売を開始することとなりましたことをお知らせいたします。

記

1. 開発・製品化の背景

スマートフォンやタブレットPCの普及に伴い、これらに搭載される高周波デバイスの旺盛な需要が続いており、当社のテストソケット「J-Contacts」はこうした高周波デバイスの最終検査で使用されております。

GND Blockは、デバイスのGNDパット専用コンタクタで、「J-Contacts」に組み込まれて使用されます。形状の違いによりFlatタイプ、Peakedタイプ、Pinタイプと3種類ありますが、異物の付着により特性が不安定となることを避けるため、頻繁にクリーニングを行う必要があり、異物の影響を受けないGNDパッド専用コンタクタが求められておりました。

こうしたことから、高周波測定に必要な電気特性は維持しながら、より接触安定性が高く、耐久性に優れたGND Block Pinタイプを新たに開発するに至りました。

2. 製品概要

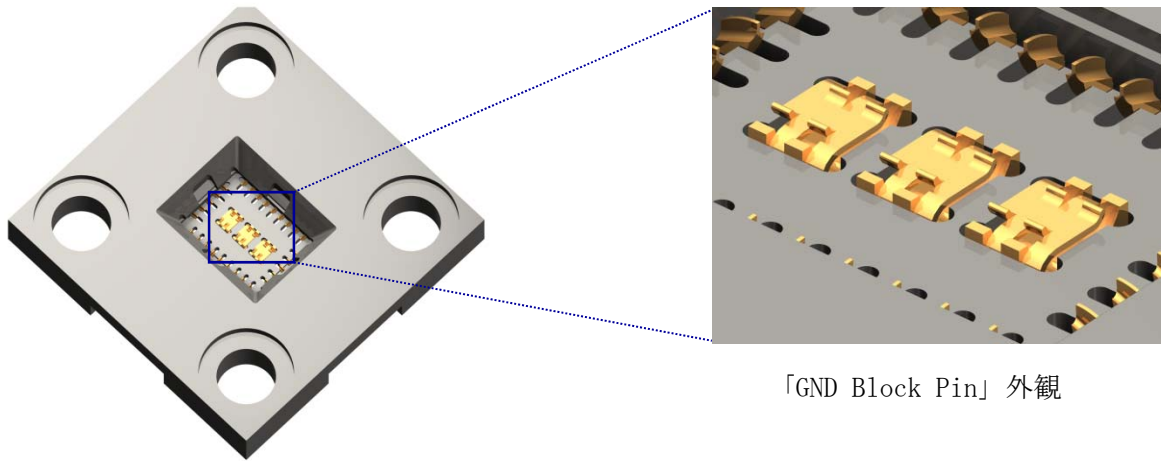
(1) 製品 GND Block Pin

(2) 主な特長

- ・ピンにスクラブ動作を加えることで接触部の異物を排除
- ・常に異物の影響を受けない状態でGNDパットへのコンタクトが可能のため、クリーニング頻度を大幅に低減
- ・従来のGND Blockと同等の高周波特性パフォーマンスを維持

(3) 主な仕様

- ・対応デバイス 小型電子部品、QFN、SON
- ・対応パット Au/NiPd
- ・対応温度 常温
- ・外形寸法 約0.4mm (テスト高さ)



「GND Block Pin」 外観

製品に関するお問い合わせ先
プローブカード事業部 営業統括部
TEL 0422-21-0155

以 上